

High Power Solid-state Switch for Replacement of Thyratron for Kicker & Klystron Modulator

R&D Status

Suk-ho An

Head of Power Supplies Group Pohang Accelerator Laboratory, Korea 2023 POCPA Workshop

Disadvantages of Thyratron Compared to Solid-State Switch





Mis-firing Fault



Reverse Conducting Fault



2023 POCPA Workshop

PAL (Pohang Accelerator Laboratory) and KERI (Korea Electrotechnology Research Institute) Collaboration





Key Technological Elements for the Development of High-Power Solid-State Switches







Development of Synchronous Operation & High Current Driving Technologies for Switch

1) Design of Switch Synchronous Operation Scheme



Simultaneous Supply of Isolated Driving Power & Signal using a Transformer

(vs. Multiple High-Voltage Insulated Power Supplies + Opto-Coupler Driving)

 \rightarrow Reduced Implementation Cost of Driving Circuit and Precise Synchronous Operation

KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

2) Design of Gate Driver for Switch in High Current Operation



- Long Pulse Driving Method using Short On/Off Pulse \rightarrow Gate TR Size \downarrow - On/Off Pulse Rectification Circuit \rightarrow Simplified High-Voltage Insulated Driving Power Supply Gate Charge Equalization & Minimization \rightarrow Optimized synchronous operation and High current driving

- -



Design of Voltage Balancing Circuit & Inductance-Reducing Series-Stacking Structure

- Considerations for Component Series-Tacking \rightarrow Voltage Balancing & Inductance Reduction for Achieving Fast Current Rise Rate



3) Design of Voltage Balancing Based on RCD Snubber





4) Design of Inductance-Reducing Series-Stacking Structure



<Photo of Inductance-Reducing Stacking Structure and Fabrication>



Current Flow



Selection of Optimal Stacking Components under Pulse Operation Conditions

Part Name	FF450R12KT4	SKM600GM12E4	SKM900GA12E4	FZ600R17KE4	
Photo	e.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Anizeon (GBT only 0) Anizeon (GBT only 0)	
Structure				2 3 5	o
Manufacturer	INFINEON	SEMIKRON	SEMIKRON	Infineon	
DC Voltage/Current Ratings	1200V(×2) / 450A	1200V / 600A(×2)	1200V / 900A	1700V / 600A	
Pulse Current Rating	900A @ 1ms	1800A(×2)	2700A	1200A @ 1ms	
Review Results	Internal Gate Drive	Line Issues in Switch	Ease of Stacking	Structural Design	Pri







Switch Specifications for Kicker Modulator



<CX1836A (E2V)>



Existing Kicker		Newly	Fabricatec	l Kicker		
Min	Typical	Max		Min	Typical	Max
		50	Peak Forward Anode Voltage (kV)			35
		<10	Peak Inverse Anode Voltage (kV)			35
		10	Peak Anode Current (kA)			10
			Rate of Rise of Anode Current (kA/µs)			>100
		10	Average Anode Current (A)			2
10			Cathode Heating Time (min)	15		
10			Reservoir Heating Time (min)	15		
0		40	Ambient Air temperature (°C)	0		40
	200	350	Anode Delay Time (ns)		100	250
	3	10	Time Jitter (ns)		1	5
	20		Recovery time (µs)			

<The Specifications of Thyratrons>

	Min	Typical	Max
Peak Forward Voltage (kV)			16
Peak Inverse Anode Voltage (kV)			13.5
Peak Operating Current (kA) @ 6µs			10
Rate of Rise of Anode Current (kA/µs)			6
Average Anode Current (A)			0.37
Ambient Air temperature (°C)	0		40
Anode Delay Time (ns)			100
Time Jitter (ns)			2

<The Required Specifications for Thyratron Replacement>





<CX1154C (E2V)>



Switch Specifications for Klystron Modulator



<CX1836A (E2V)>

KERI KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

CX18	CX1836A (PAL-XFEL)			L4888 (PLS-II)		·II)
Min	Typical	Max		Min	Typical	Max
		50	Peak Forward Anode Voltage (kV)			55
		<10	Peak Inverse Anode Voltage (kV)			<10
		10	Peak Anode Current (kA)			15
			Rate of Rise of Anode Current (kA/µs)			25
		10	Average Anode Current (A)			8
10			Cathode Heating Time (min)	15		
10			Reservoir Heating Time (min)	15		
0		40	Ambient Air temperature (°C)	0		40
	200	350	Anode Delay Time (ns)		400	
	3	10	Time Jitter (ns)		10	
	20		Recovery time (µs)			

<The Specifications of Thyratrons>

	Min	Typical	Max
Peak Forward Voltage (kV)			46
Peak Operating Current (kA) @ 10µs			8.5
Non-Repetitive Peak Current (kA) @ 10µs			17
Rate of Rise of Anode Current (kA/µs)			10
Average Anode Current (A)	0.64 @10Hz	3.83 @60Hz	7.66 @120Hz
Ambient Air temperature (°C)	0		40
Anode Delay Time (ns)			200
Time Jitter (ns)			1

<The Required Specifications for Thyratron Replacement>





<L4888 (E2V)>



Design of Solid-State Switch Unit Modules for Multi-purpose Use



<Circuit diagram of the unit module>







<Implemented unit module>



<Circuit and structure for the development of IGBT-based high-power switch unit module >







From Thyratron to Solid-State Switch Kicker Modulator Conversion







<Configuration Diagram of Kicker Modulator with Solid-State Switch>

PAL POHANG ACCELERATOR LABORATORY

Optimizing In-house Design and Fabrication of a Solid-state switch-based kicker modulator.



<Circuit Design for Solid-state based Kicker Modulator>

<Simulation Analysis Results of Component Operating Conditions>



<High Power Switch based on IGBT>





<High Precision High Voltage Capacitor Charger>



<High Voltage Blacking Diode>



<High Voltage Capacitor Bank>

Inergy	Average Power
IJ	20W
Inergy	Average Power
IJ	50W
Current	RMS Current (A)
Α	1A
Inergy	Average Power
0 J	1,053W
Current	RMS Current
A	26A
oltage	Peak Reversal Voltage
00V	-8,000V
urrent	Reverse Recovery Time
A	< 100ns



<Reversal Diode & Tail Diode>



Fabrication and Testing Results of the Kicker Modulator







Performance Verification Test Results and Certification



<Maximum 15kV Voltage and 10kA Current Performance>



<Max Current Rise Time 6.4kA/us Performance>

KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

KERI



<Jitter Standard Deviation 780ps Performance>



<Maximum Repetition Rate of 60Hz Performance>



나. 시험결과





mV/div.)

		시후
<	전류	상
3) <u>\$</u>	실로스	코.
이하).	으로부	터
		시험
<	전류	상성
		-





한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 21-070179-01-1 Report No. 페이지 (4)/(충 8) Page of Pages	kti .
한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	패이지 (4)/(총 8) Page of Pages	

험항목	시험방법	관정기준	결과
및 전류 측정	의뢰자 제시방법*1)	15 kV 이상	15.404 kV로 기준에 적합함.
		10 kA 이상	10.008 kA로 기준에 적합함.

'¹⁾ 커패시터 충전기의 전압을 올려가면서 전압 및 전류를 오실로스코프의 'Measurement'기능으로 값 한다. CH1 : 스위치 전류 Isw (2 kA/div.), CH4 : 스위치 양단 전압 Vsw(5 kV/div.)

험항목	시험방법	판정기준	결과
터 측정	의뢰자 제시방법*2)	1 ns 이하	780.01 ps로 기준에 적합함.

정격전류(10 kA) 조건에서 기준전압으로부터 출력되는 전류 신호까지의 지연시간 표준편차를 측정하다 정되는 전류의 신호를 1,000 회 이상 누적하여 누적된 신호가 갖는 지연시간의 표준편차(Std 다. 오실로스코프의 'infinite'기능을 이용하여 파형을 누적하고 'pop'값을 이용하여 표준편차는 오실로스코프내의 'Measurement' 기능을 활용하여 'Std Dev'값을 측정한다. CH1 Isw(2 A/div., offset: 2 kA), CH3 : 기준전압 Vref(Von 으로부터 710 ns의 delay를

험항목	시험방법	판정기준	결과
상중률 측정	의뢰자 제시방법*3)	6 kA 이상	6.429 kA로 기준에 적합함.

프의 'Cursor' 기능을 활용하여, 정격전류(10 kA) 조건에서 전류가 상승하기 시작한 시점(100 A 1 us 동안 전류가 상승한 값을 측정한다. CH1 : 출력 전류(2 kA/div.)

험항목	시험방법	판정기준	결과
승시간 측정	의뢰자 제시방법*4)	1.6 µs 이하	1.463 µs로 기준에 적합함.

프의 'Cursor' 기능을 활용하여, 정격전류(10 kA) 의 상승시간(전류가 첨두치 기준 10[°] %부터 90 %까지 상승하는 시간)을 '측정한다. CH1 : 출력 전류(2 kA/div.)

험항목	시험방법	판정기준	결과	
복률 측정	의뢰자 제시방법*5)	60 Hz 이상	60 Hz로 기준 ~ 적합함.	

*5) 오실로스코프의 분해능을 고려하여 4 µs/div. 로 첨두치 측정 후, 10 ms/div. 로 변경 하고 'Measurement 기능을 활용하여 주파수를 측정한다. CH1 : 스위치 전류(2 kA/div.)

<Korea Testing Laboratory (KTL) Certified Test Report>

POHANG ACCELERATOR LABORATORY

Reliability Testing of Solid-state Switch and Test Results



<Reliability Test Set-up>















<Switch & Tail Resistor Temperature Measurement Results>





27.5°C

<Diode & Capacitor Module Temperature Measurement Results>



<Accumulated Output Current Waveform of 5 million Shots>

_	_	_	_	_

							1/3
1		신뢰성	성 시험	기록일	X	작성자	
						작성일자	
	. J.						
		PAL	PAL	PAL	KERI	KERI	KERI
		1	1	1	1	1	1
Ę	병 키커 또	그들레이터용)	반도체 스위치	사	양 15 k	V, 10 kA, 10	uS, 10 Hz
1장 :	노 포항가	속기연구소 연	구2동 103호	시험시	작일 2022	년 11월 15일	
				시험종	료일 2022	년 11월 25일	
1 2	저						
1.57							
. 8.							
·영.	지					* 시험진학	행자 기준 작성
1987 참 일 자	지 시험자	진행시작시간	진행종료시간	시험간 Fault 발생여부	사험간 재기동여부	※ 시 험진학 시험간 외기온도	행자 기준 작성 측정 Shoot 수
1 일 자 . "	지 시험자 ひで気 44年	진행시작시간 09:45	 ひゃくろう ひゃくひ ひゃくひ ひゃくひ ひゃくひ ひゃくひ ひゃくひ ひゃくひ ひゃく	시험간 Fault 발생여부 X	사험간 재기동여부	※ 시험진학 시험간 외기온도 	행자 기준 작성 측정 Shoot 수 4/03/4/0
1 일 자 . <u>'</u>	지 시험자 <i>산代</i> 公 444年 书창 한 김대충	진행시작시간 09:45 고요: f(2.0×5-6 08×10	시험간 Fault 발생여부 X	사험간 재기동여부 火	* 시험진혁 시험간 외기온도 	행자 기준 작성 측정 Shoot 수 <i>403/40</i> 8//850
198. 198. 198. 198. 198.	ス	진행시작시간 09:45 ユュミナ(08:18	2888 = A2 20-56 08:19 20:45	시험간 Fault 발생여부 X X X	사험간 재기동여부 火 火	* 시험진혁 시험간 외기운도 	행자 기준 작성 측정 shoot 수 <i>403/40</i> 8/1850 126008
198. 전 자 <i>化</i>	지 시험자 관련을 하여든 관련을 김대를 관련을 , 김명과 관련은 , 김명과	진행시작시간 09:45 20:16 08:18 20:45	298番星시간 ユロンチ6 ログン1月 ユロンチ5 ログン3人	시험간 Fault 발생여부 ····································	시험간 재기동여부 乂 乂 乂	* 시험진학 시험간 외기운도 구.3 2/ 2년	측정 shoot 수 403/40 8/1850 1260008 1688200
198. 198. 198. 198. 198.	지 시험자 전····································	石物시작시간 のマングチ ユョントイ のなン18 ユーロッチ のないなり のないのないの の の の の の の の の の の の の の	진행종료시간 고 0 : 5 - 6 0 7 : 1 / 7 2 0 : 45 0 8 : 3 2 2 0 : 5 - 5 8	시험간 Fault 발생여부 X X X X	시험간 재기동여부 옷	* 시험진학 외기온도 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7	本 本 本 な 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
198. 198.	N 11 12 12 12 12 12 12 12	- 전想시작시간 の 2、45 - 20、18 - 20、45 の 8、39 - 20、47 - 20、47	2885 - Alt 20:56 08:19 20:45 08:38 20:58 08:27 	시험간 Fault 발생여부 X X X X X	시험간 재기동여부 옷	** 시험진학 외기운도 고 2/ 15 16 19 5	ボ 기준 작성
198. 198.	ス 人富み をなら、44年7 そなら、344 んちを、344 でいた、344 ひから、144を ひから、144 でなた、みをあ のたち、4554	전형시작시간 09、45 20、15 08、18 20、45 08、39 20、45 08、39 20、45 08、39 20、45 08、39 20、45 08、39 20、45	21日春日 10356 08:10 20:45 08:32 20:48 08:21 20:48	시험간 Fault 발생여부 X X X X X	시험간 제기동여부	* 시험진학 시험간 외기운도 구. 1도 16 기명 및 (응) (위 및 (응)	本 기준 작성
198. 198.	X 人園本 発行会 44年7 242 を 30倍 人仕谷 30倍 化44 30 化44 30 化44 30 化44 30 化45 30 000 000 000 000 000 000 000	전형시작시간 09、45 20、16 20、145 08:39 20、45 08:39 20、45 08:32 20、45 08:22	288番風A社 10:56 08:19 20:45 08:38 20:548 08:21 20:55 10:00 10:0	시 웹 간 Fault 발생여부 X X X X X X X X X X	시험간 제기물여부 火 火 × × × × × ×	* 시험신역 시험간 외기운도 2./ 15 - 15 - 15 - 15 - 17.9 - 17.	本 기준 작성 5hoot 4 <i>403/40</i> 8/1850 1260008 168820 25/689 25/209 25/200 200520+ 300520+ 3005204
198. 198.	지 시험자 전·영습 64467 전·영습 80486 전·영습 80486 전·영습 80486 전·영습 10406 전·영습 10406 전·영습 10406 전·영습 10406 전·영습 전·영습 전·영습 전·영습	2184412 09:45 20:16 08:18 20:45 08:39 20:45 08:32 20:55 08:22 20:55	1時高量A12 ユロニケ6 の下:11 20:45 20:45 38 ユロニケ6 の下:11 20:45 38 ユロニケ6 の下:11 20:45 38 ユロニケ6 の下:11 20:45 45 55 55 55 55 55 55 55 55	시험간 Fault 발생여부 × × × × × × × × ×	사험간 재기울여부 火 火 × × × × × × × × ×	* 시험진전 시험간 외기운도 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7	4× 기준 작성
198. 198.	ス 人留本 やから 30485 やから 30485 たいち、3200 たいち、3200 やいち、3200 やいち、424 たいち たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち、424 たいち たいち たいち たいち たいち たいち たいち たいち	2181/24/2 09:4/5 20:1/8 20:4/5 08:39 20:4/9 08:32 20:55 09:00 20:55	2880047 20566 の下:10 20145 08:32 20558 20558 1500 20547 100 20547 100 20547 100 20547 100 20547 100 20547 100 100 100 100 100 100 100 10	시험간 Fault 발생여부 × × × × × × × × ×		* 시험진적 시험간 외기온도 23 2/ 15 16 17 5 47 5 47 5 47 5 47 5 47 5 47 5 47 5	本 기준 작성 素習 5hoot 4 <i>403140</i> 8/1850 26008 268820 25608 25608 270520 4 302204 302204 302204 3026806 4158720 4458720
198. 198. 19 19 18 19 19 1.200	ス) 小葱水 かかき 3005 かかき 3005 たいな、2000 かいか、1003 ひける。いかいろ ないた。2000 ひける、いかいろ やいた。2000 ひける、2000 ひける ひける ひける ひける ひける ひける ひける ひける	辺想시작시간 の7:45 コン:16 フク:45 の8:39 コン:55 の8:32 ユン:55 09:00 ユン:55 09:00 ユン:57 09:38	2988242 20:46 08:19 20:49 08:34 20:48 08:24 30:48 30:48 30:48 30:48 30:48 30:48	시智간 Fault 발생여부 X × × × × × × × × × × × × ×	시智	* 시험진역 시험간 외기운도 2/ 1/5 1/9. 6 1/9. 6 1/9. 6 1/9. 6 0. 4 0. 4 0. 4 0. 4 0. 5 1/9. 5	本 기준 작성
198. 198. 19 19 19 19 19 1.20 2/	ス 人間本 でため、4467 大学を、3448 1426 3448 1426 3448 1426 3448 2442 3484 2442 3484 2442 3484 2442 3484 2442 3484 2442 3484 2442 3484 2442 3484	284A8A2 09:4/5 20:4/5 20:4/5 20:4/5 20:4/5 20:5/7 08:39 20:5/7 08:39 20:5/7 08:22 20:4/5 20:4/8 20:38 20:5/8	2個悪品人で ユの:チル の方: ノー シロ: 45 の方: 33 シロ: 45 の方: 35 シロ: 45 の方: 20 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	시智간 Fault	A)智む 項71多句早 メ メ × × × × × × × × × × × × ×	* 시험진역 시험간 외기운도 2/ 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	本 기준 작성
198. 199. 191.	X1 人間本 見信愛、64467 2426 3048 た426、2300 かいわ、10 のみ のはなさ、1040 のはなさ、1040 なくたこ、242 やいた、242 よりた、2452 したし、1454 とくた、2454 とくた、2454 とくた、2455 こ445 こ445 2455 2555 24555 24555 24555 24555	284A&A2 09:45 20:45 20:45 20:45 08:39 20:52 20:52 20:52 20:53 09:52 20:59 09:48 20:53 09:49 20:38 68:15 70:47	285 24/2 20:46 08:47 08:38 20:47 08:24 9:00 20:47 9:48 20:47 9:48 20:47 9:48 20:47 9:48 20:47 08:14 20:47 08:42 20:48 20:4	▲智む Fault 豊初の早 メ × × × × × × × × × × × × ×	시험간 제기중여부 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	* 시험진직 시험간 외기용도 2, 15 15 15 17, 9 18 17, 9 17, 8 17, 8	本 기준 작성
198. 198. 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	X 小菌本 建築 4447 24後 3446 24名 5200 24名 5200 24名 5200 24名 5200 24名 542 242 542 242 542 242 542 242 542 242 542 242 542 242 542 242 542 242 542 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 2442 544 544 544 544 544 544 544 544	21844242 09:45 20:18 20:45 08:39 20:45 08:39 20:45 08:45 20:45 08:45 20:45 08:48 20:49 20:49 20:49 20:49 20:49	21日本 20:56 07:19 20:57 08:38 20:558 08:25 30:558 7:00 20:579 08:14 20:579 08:14 20:579 08:14 20:579 08:14 20:579 1	시험간 Fault 豊砂の早 メ × × × × × × × × × × × × ×		* 시험진직 시험간 외기온도 23 2/ 15 16 19.5 	本 기준 4성
198. 198. 199. 199. 199. 199. 100 100 100 100 100 100 100 10	ス 人富本 や生き 3008 たいなし、ひゃい たいなし、ひゃい たいなし、ひゃい たいなし、ひゃい たいなし、ひゃい たいなし、ひゃい たいなし、ない たいなし、 たいなし、 たいなし、 たいない たい たいない たい たいない たい たい たい たい たい たい たい たい たい た	2944442 09:44 20:14 08:18 20:45 08:39 20:45 08:39 20:45 08:45 09:00 20:14 08:48 00:38 68:15 70:44 08:143 20:14	$\begin{array}{c} \boxed{2} \hline \hline \\ \hline \\ \hline \\ 10.5 + 6 \\ of: 1/7 \\ 20: 4/5 \\ \hline \\ 20: 4/5 \\ \hline \\ 20: 5/8 \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ 7: 0.0 \\ \hline \\ 00: 5/8 \\ \hline \\ 0: 5/8 \\ \hline 0: 5/8 \\ \hline \\ 0: 5/8 \\ \hline 0: 5/8 \\ \hline \\ 0: 5/8 \\ \hline 0: 5/8 \\ \hline 0: 5/8 \\ \hline 0$	시智간 Fault 豊切の早 メ × × × × × × × × × × × × ×		* 시험진역 시험간 외기용도 23 2/ 15 19 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	本 21 そ 4 次 素習 5hoot キ 403140 8/1850 1260028 268028 24545 2770547 32024 32024 32025 4158727 54054512 54054512 5305543 63305543 63305543 63305543
18. 198. 198. 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	X 人)首本 伊卡曼、白北谷 大学生き 300名 月14名、2000 かり約、3043 ウイオる、2000 かり約、3043 ウイオる、2000 かり約、3043 ウイオる、2000 ウイオる、2000 こそう、2003 まんま まんま まんま まんま まんま まんま まんま まん	284A8A2 09:4/5 20:4/5 20:45 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 20:55 09:00 20:29 20:49 20:49 20:49 20:44 20:44	 20185年人行 20:56 07:19 20:45 08:24 20:57 20:50 39:46 20:50 20:50 	시智간 Fault		* 시험진역 시험간 외기음도 2/ 1/5 1/9.9 1/9.9 1/9.9 1/9.9 1/9.5 20.3 20.3 20.4 1/9.5 20.3 20.4 1/9.5 20.3 20.4 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9	本 기준 本場

- 1 -<Reliability Test Log>



Solid-state switches Developed thus Far.



<15kV,10kA & 50kV, 10kA Solid-State Switch Prototypes> (PAL Kicker & Klystron Modulator) <25kV,10kA & 50kV, 10kA Solid-State Switch (Packaging)> (4GSR Kicker & Klystron Modulator)





PAL POHANG ACCELERATOR LABORATORY

Application to the Modulator for DIRAMS' LINAC-based Experimental Animal Irradiator



POHANG ACCELERATOR LABORATORY

2023 POCPA Workshop

Future Plans





<PAL Injection Test Facility Gun, Injector, Klystron& Modulator>

- The PAL Injection Test Facility is a facility that simulates and allows experimentation with the actual LINAC components such as the gun, injector, klystron, and modulator, which were used during the construction of PAL-XFEL. Currently, it serves as a facility for testing devices and beams.
- The plan is to utilize the Solid-State Switch for long-term reliability testing by _ replacing the Thyratron with it.

POHANG ACCELERATOR LABORATORY

Thank you for listening to my presentation.

If given the opportunity, I would like to share our developed switch and technology and have the chance to discover its shortcomings together, so that we can work on improving them collaboratively. Thank you

Suk-ho, An

Sung-Roc, Jang

whiteyan@postech.ac.kr

scion10@keri.re.kr



